

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (波形判定器 <WAVE COMPARATOR>)
形名<Model Number> (8731)
製造番号<Serial No.> (No. 110713307)
検査年月日<Test Date> (2011-07-11)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (27.0 °C, 65 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	*2 測定値 <Measured Value>
--------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------------------

1. 確度<Accuracy>

-1. ゼロ位置確度

<Zero Position>

100 mV/DIV 0 V -0.001 V ~ 0.001 V (CH1 0.000 V) (CH2 -0.001 V)
*1

-2. DC振幅確度

<DC Amplitude>

100 mV/DIV 1 V 0.995 V ~ 1.005 V (CH1 1.001 V) (CH2 1.000 V)
200 mV/DIV 2 V 1.990 V ~ 2.010 V (2.001 V) (2.001 V)
500 mV/DIV 5 V 4.975 V ~ 5.025 V (5.003 V) (5.003 V)
1 V/DIV 10 V 9.950 V ~ 10.050 V (10.000 V) (10.006 V)
2 V/DIV 20 V 19.900 V ~ 20.100 V (20.000 V) (20.025 V)
5 V/DIV 50 V 49.750 V ~ 50.250 V (50.000 V) (50.063 V)

2. 機能<Function>

結果<Result>

	CH1	CH2
-1. 時間軸確度<Time Base Accuracy>	(PASS)	(PASS)
-2. 方形波特性<Square Wave Characteristic>	(PASS)	(PASS)
-3. 周波数特性<Frequency Characteristic>	(PASS)	(PASS)
-4. フィルタ動作<Filter>	(PASS)	(PASS)
-5. 入力結合切替<Coupling>	(PASS)	(PASS)
-6. データストレージ、圧縮機能<Data Storage Compression>	(PASS)	(PASS)
-7. トリガ機能<Trigger Function>	(PASS)	(PASS)
-8. ROM/RAMチェック<ROM/RAM Test>	(PASS)	
-9. キーチェック<Key Test>	(PASS)	
-10. 画面チェック<Display Test>	(PASS)	
-11. 外部制御端子<External Control Terminal>	(PASS)	

備考<Note>

*1 ゼロポジション確度は、入力結合(カップリング)GNDにて校正しています。入力結合(カップリング)GNDとは内部回路で入力とGNDを短絡することです。
<The accuracy of the zero position is calibrated by coupling GND. Coupling GND means to short input and GND at the inner circuit.>

*2 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。
<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No. 8731-4